

高效检验和调试 DDR5 内存接口

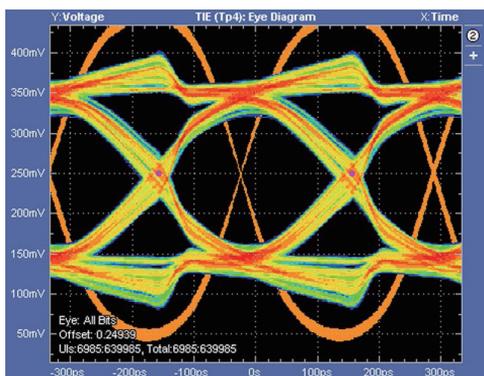


内存技术正在迅速发展，您的测量工具能跟上节奏吗？

5G 正在迅速发展，并推动着各种新技术的增长，从增强现实和人工智能，到云计算和物联网。所有这些数据都必须存储在某个地方，并以更快的速度访问，因此 DDR5 之类的技术正变得前所未有的重要。DDR5 改善了带宽、密度和通道效率，但数据传送速率更高，信号速度更快，意味着复杂的设计，这会挑战信号完整性极限，在一致性测试、调试和验证中要求更高性能的测量。

泰克 TekExpress DDR5 发射机解决方案是一种系统级自动测试应用，可以迅速、高效、可靠地验证和调试 DDR5 设计，满足 JEDEC 规定的 50 多种电气和定时测量。

DFE 分析



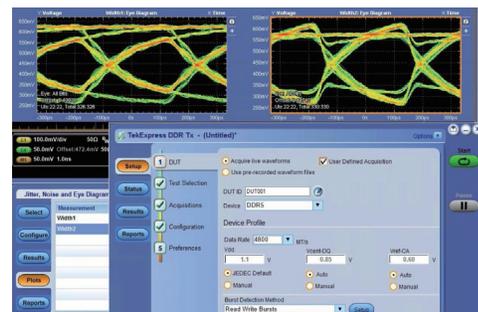
在测试 DDR5 设计时，由于存在符号间干扰 (ISI)，即使是调试 DDR3/4 时使用的最好的技术，也会变得力不从心。我们的 DDR5 系统级一致性测试软件提供了各种自动工具，克服了下一代 DDR 带来的挑战，包括：

- 支持 Rx DFE 均衡，在突发的 DDR5 业务上进行写入数据眼图测量
- 自动测量 JEDEC 规定的 50 多种 DDR5 电气和定时参数
- 采用新算法，统一可靠地区分读出和写入突发
- 采用新的一致性测试应用架构，加强自动化，缩短测试时间，帮助您更快地把产品推向市场

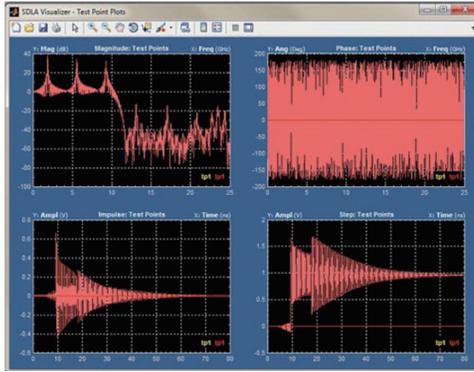
调试和验证

TekExpress DDR5 发射机解决方案把控制能力还回本应的位置，那就是用户手中。通过用户自定义采集模式，您可以量身定制示波器设置，比如采样率、记录长度、带宽等等，运行 DDR5 JEDEC 一致性测量。

我们的独立式 DDR5 DFE 应用可以全面控制 DFE 增益和 4 阶值，您可以运行自己的内部测试计划，而不是 JEDEC 规定或控制的测试计划。您还可以执行测量仿真关联，精调仿真模型，通过改变 4 阶和增益值来进行若则分析。



SDLA



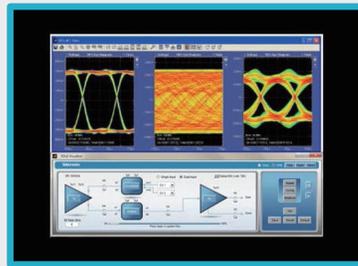
在反嵌 DDR5 设计时，验证 S 参数通常是一个主要问题。通过改进无源校验、端口分配和绘图功能，串行数据链路分析 (SDLA) 不仅增强了 S 参数文件验证，还改善了灵活性，节省了时间，提高了我们对反嵌流程的信心。其他调试软件工具要求完成整个流程才能发现结果，而 TekExpress DDR5 发射机解决方案可以在早期检测到问题，可以更高效的调试和优化设计。SDLA 功能还有助于执行 DFE 分析。

如需更多信息，请查阅我们的 [SDLA 应用指南](#)。



DDR5 电气检验和调试

查看我们的产品技术资料，更深入地了解 TekExpress DDR5 发射机解决方案软件，以及其可以怎样轻松帮助您分析和优化复杂的 DDR5 设计。



串行数据链路分析可视化器

SDLA 可视化器测量电路软件直接在示波器上运行，为计算嵌入和反嵌滤波器提供了全面的功能，实时进行测量仿真。



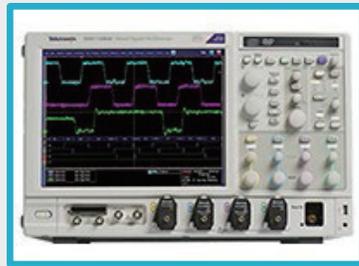
P7700 系列 TriMode 探头

由于焊接尖端和探头输入缓冲器安装在距尖端末端仅几毫米的位置，P7700 系列 Trimode 探头特别实用，非常适合测试极具挑战性的电子设计。



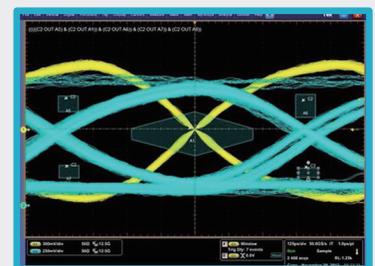
DPO7000SX ATI 示波器

DPO7000SX ATI 高性能示波器以业内最高的准确度捕获高速信号特点，检验、验证和表征下一代设计。



MSO/DPO70000 示波器

业内最高的波形捕获功能，发现实际信号，捕获更多细节。自动设置、采集和分析高速串行数据信号。



TekExpress 一致性测试 / 调试

泰克 TekExpress DDR Tx 是一种自动测试应用，用来根据 JEDEC 规范验证和调试被测器件中的 DDR5 和 LPDDR5 设计。